
編集後記

Vol. 14 から副編集長の任を仰せつかり、本号では ToF-SIMS 特集号を企画しました。ToF-SIMS は 1990 年代に入って急速に普及したまだ歴史の浅い評価手法ですが、その射程の広さからあらゆる材料・目的に利用が急拡大しています。最近の装置技術の進展は目覚しく、例えば試料表面に照射する一次イオンには細線化しやすい Ga が当初使われていましたが、分子イオン種をより高感度に検出できる Au_n や Bi_n などの金属クラスターイオン、C₆₀ などの多原子クラスターイオンに置き換わってきています。さら

に最近の話題では、ガスクラスターイオンや帯電水滴など、より巨大なクラスターイオンの応用研究が進展しています。こうした ToF-SIMS を取り巻く日進月歩の状況が本号の特集記事に紹介されています。まだ成熟の途上にある ToF-SIMS は、AES・XPS・EPMA などの従来手法と相補的に活用されることでより深い理解が得られるため、SASJ でも ToF-SIMS を指向した活動を活発化させていきたいと考えています。

(阿部)

JSA Journal of Surface Analysis

JSA 編集委員会 jsa@sasj.jp Tel: 06-6879-4162 Fax: 06-6879-4162

編集委員長：永富隆清（大阪大学）

副編集委員長：阿部芳巳（三菱化学科学技術研究センター）

編集理事：福島整（物材機構）

編集委員：井上雅彦（摂南大学），荻原俊弥（物材機構），河合潤（京都大学），
木村昌弘（日鉱金属），佐藤美知子（富士通クオリティ・ラボ），城昌利（産総研），
堂前和彦（豊田中研），中村誠（富士通研究所），柳内克昭（TDK）

.....
SASJ: International Advisory Board

J. T. Grant (University of Dayton, USA)

H. J. Kang (Chungbuk National University, Korea)

S. Hofmann (Max-Planck-Institute for Metals Research, Germany)

A. Jablonski (Institute of Physical Chemistry, Poland)

C. J. Powell (National Institute of Standards and Technology, USA)

M. P. Seah (National Physical Laboratory, UK)
.....

Journal of Surface Analysis Vol. 14, No. 3

編集・発行：無限責任中間法人表面分析研究会

<http://www.sasj.jp/>

2008 年 4 月 30 日 印刷

2008 年 4 月 30 日 発行

発行所：〒108-0074 東京都港区高輪 3-6-7

無限責任中間法人表面分析研究会

電話：03-3473-6878 FAX：03-3473-8652

Printed: April 30, 2008

Published: April 30, 2008

Published by

The Surface Analysis Society of Japan

Takanawa 3-6-7, Minato-ku, Tokyo 108-0074

Tel: +81-3-3473-6878

Fax: +81-3-3473-8652